

<b>Mikroelektronika a technologie součástek</b> <b>Ústav mikroelektroniky</b> <b>FEKT VUT v Brně</b>			<b>Jméno</b> <b>Jakub Charvot</b>	<b>ID</b> <b>240844</b>
			<b>Ročník</b> <b>3.</b>	<b>Obor</b> <b>MET</b>
<b>Spolupracoval</b> –	<b>Měřeno dne</b> 23.10 2023	<b>Odevzdáno dne</b> 19.10. 2023	<b>Hodnocení</b>	
<b>Název zadání</b> <b>Měření vlastností tlustovrstvých rezistorů</b>				<b>Č. úlohy</b> <b>3</b>

## 1 Teoretický úvod

## 2 Praktická část

### 2.1 Měření odporů čtyřbodovou metodou

Čtyřbodovou metodou jsme měřili substrát č. 4. K napájení soustavy byl použit laboratorní zdroj (MATRIX MPS-3005L-3) a nastavovali jsme proud 1 mA, který jsme měřili a kontrolovali za pomoci digitálního multimetru (KEYSIGHT 34465A). Pro některá měření rozsah zdroje nestačil pro vytvoření tohoto proudu, měřili jsme tedy s proudem menším. Po nastavení proudu jsme měřili napětí druhým digitálním multimetrem (UNI-T UT804).

### 3 Závěr

## Reference